



Reviewer's Recognition

The Editor and Editorial Board of the ASME *Journal of Tribology* would like to thank all of the reviewers for volunteering their expertise and time reviewing manuscripts in 2020. Serving as reviewers for the journal is a critical service necessary to maintain the quality of our publication and to provide the authors with a valuable peer review of their work. Below is a complete list of reviewers for 2020. We would also like to acknowledge three outstanding Reviewers of the Year.

2020 Reviewers of the Year

Wassim Habchi — Lebanese American University, Lebanon

Ali Beheshti — George Mason University, USA

Chengjiao “Evan” Yu — Northwestern University, USA

The Reviewers of the Year Award is given to reviewers who have made an outstanding contribution to the journal in terms of the quantity, quality, and turnaround time of reviews completed during the past 12 months. The prize includes a Wall Plaque, 50 free downloads from the ASME Digital Collection, and a one-year free subscription to the journal.

List of TRIB Reviewers

A. Adeniyi	S. Boedo	M. Ciavarella
F. Aliabadi	D. Bompos	J. Cochain
D. Alves	P. Bonello	C. Cole
L. Amami	A. Borjali	H. Cui
W. Anderson	J. Bozet	Q. Dai
S. Aoki	D. Bozkaya	A. Das
A. Arcifa	L. Branagan	C. Davies
M. Arghir	V. Brizmer	P. Davim
L. Badita	N. Brunetiere	N. De Laurentis
A. Bahrami	C. Burkhart	D. Dearnley
N. Bailey	D. Burroughs	C. DellaCorte
V. Bakolas	T. Cameron	M. Devlin
S. Bapat	L. Cao	M. Dienwiebel
D. Barber	K. Chang	H. Ding
F. Bauer	L. Chang	W. Ding
G. Bayada	Q. Chao	F. Dohnal
A. Beheshti	S. Chatra	G. Dong
U. Bhattiprolu	A. Chauhan	D. Durban
N. Biboulet	A. Chavez Luna	S. Duriseti
R. Bidkar	G. Chen	M. El Gadari
J. Bijwe	Z. Chen	T. Eldridge
C. Bindal	D. Childs	I. Etsion
T. Blanchet	G. Chimata	R. Evans
A. Blume	G. Chochua	X. Fang
K. Bobzin	R. Chromik	E. Fatourehchi

A. Fatu	K. Liew	V. Saikko
K. Feng	L. Lin	A. Samanta
M. Fillon	D. Liu	L. San Andres
R. Fleming	F. Liu	S. Sasaki
V. Fridrici	H. Liu	B. Sauer
C. Gachot	K. Liu	M. Scaraggi
S. Ghosh	Q. Liu	J. Schiffmann
S. Glavatskih	R. Liu	J. Schmied
M. Goto	X. Liu	S. Shaffer
J. Greenwood	Y. Liu	T. Shao
P. Grzyska	N. Londhe	A. Sharma
F. Guo	W. Lu	R. Sharma
Y. Guo	Y. Lu	C. Shen
W. Habchi	A. Lubrecht	Y. Shen
C. Hager	T. Ma	Q. Sheng
R. Hamade	X. Ma	J. Shi
X. Han	K. Mabuchi	Q. Shi
A. Harsha	M. Maciag	Z. Shi
M. Hasan	N. Mandal	K. Shimizu
A. Hase	A. Maoui	D. Shin
M. Hasler	M. Masen	P. Shipway
T. He	X. Meng	A. Shvarts
S. Hsu	Y. Meng	M. Simin
X. Hu	D. Meyer	V. Simon
Y. Hu	I. Minami	S. Singh
Z. Hu	S. Mischler	S. Sinha
Y. Huang	J. Misra	S. Sivasankaran
A. Igual Munoz	T. Miyajima	E. Smith
M. Jarray	J. Mo	R. Stango
A. Jayachandran	H. Mohseni	B. Strahin
S. Jeung	G. Mollon	J. Streator
P. Jolly	S. Momozono	H. Su
H. Jones	L. Moraru	Y. Su
M. Jones	F. Mortazavi	J. Suh
S. Kailas	F. Mubarak	S. Suh
N. Kang	M. Murashima	I. Svetlizky
G. Kastane	N. Nemati	E. Swanson
H. Kato	P. Nikolakopoulos	W. Tan
F. Kennedy	B. Normand	Z. Tang
P. Keogh	M. Nosonovsky	I. Taylor
K. Khanlari	M. Ochiai	M. Teodorescu
C. Kim	K. Ono	M. Thakare
D. Kim	T. Otsu	A. Thakre
H. Kim	A. Ozer	M. Thorat
Y. Kim	A. Pandkar	W. Tian
H. Kinoshita	A. Papangelo	Y. Tian
K. Kitamura	P. Pawlus	P. Tichy
T. Kobayashi	C. Peng	M. Tiwari
R. Koosha	W. Peterson	M. Tiwari
A. Kovalev	A. Pitenis	T. Tokoroyama
V. Krithivasan	B. Podgornik	M. Uddin
D. Kumar	P. Podsiadlo	J. Vail
P. Kumar	P. Ponthiaux	G. Vannini
C. Kumara	G. Popescu	M. Varenberg
J. Le Rouzic	G. Popovici	K. Vemaganti
A. Lebeck	B. Prasad	B. Vengudusamy
K. Lee	W. Pu	P. Vergne
W. Lee	B. Raeymaekers	A. Walvekar
C. Li	L. Rapoport	Y. Wan
D. Li	A. S.	C. Wang
J. Li	F. Sadeghi	D. Wang
W. Li	P. Sahoo	H. Wang
H. Liang	C. Saikaew	Q. Wang

T. Wang
W. Wang
X. Wang
H. Wegner
H. Wei
J. Wei
N. Weinzapfel
B. Wemekamp
M. Wimmer
T. Woloszynski
B. Wu
J. Wu
S. Wu
X. Wu

Z. Wu
Y. Xia
G. Xie
F. Xu
Y. Xu
E. Yanes Nunez
D. Yang
J. Yang
L. Yang
Q. Yang
S. Yao
Y. Yi
C. Yu
S. Zafar

B. Zamanian Yazdi
A. Zavos
B. Zhang
C. Zhang
H. Zhang
L. Zhang
M. Zhang
Z. Zhang
F. Zhou
G. Zhou
T. Zolper
M. Zou
X. Zuo